

journal1

[技术及应用](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[an error occurred while processing this directive] | [an error occurred while processing this directive]

## SRAM型FPGA瞬时电离辐射功能错误实验研究

齐超;林东生;陈伟;杨善潮;王桂珍;龚建成;马强

西北核技术研究所, 陕西 西安710024

## Experimental Investigations on Transient Ionizing Radiation Induced Function Errors of SRAM Based FPGA

QI Chao;LIN Dong-sheng;CHEN Wei;YANG Shan-chao;WANG Gui-zhen;GONG Jian-cheng;MA Qiang

Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi' an 710024, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

版权所有 © 2012 《原子能科学技术》编辑部  
通讯地址: 北京市275-65信箱 邮政编码: 102413  
Tel: (010)69358024 69357285 Fax: (010)69357285 E-mail: yzk@ciae.ac.cn  
技术支持: 北京玛格泰克科技发展有限公司